

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-18423-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 29.09.2020

Ausstellungsdatum: 29.09.2020

Urkundeninhaber:

Johann Fischer Aschaffenburg Präzisionswerk GmbH & Co. KG
Ruhlandstraße 72, 63741 Aschaffenburg

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- **Ebenheit** ^{a)}
- **Geradheit** ^{a)}

Winkel

- **Winkelnormale** ^{a)}

^{a)} auch als Vor-Ort-Kalibrierung

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen>

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-18423-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Länge Ebenheitsabweichung Horizontale Ebenheits- verkörperungen z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984	bis 30 µm	AA-001 2017-03 bis 10 m Kantenlänge	$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Ebenheitsver- körperung
Geradheitsabweichung ebener Flächen, z.B. 90°- Winkelnormale	bis 30 µm	AA-002 2017-03	$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Geradheits- verkörperung
Winkelabweichung am 90° - Winkelnormal	bis 30 µm	AA-003 2017-03 bis 500 mm Schenkellänge	1,0 µm	
mit ebenen Flächen		bis 1000 mm Schenkellänge	1,5 µm	

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Länge Ebenheitsabweichung Horizontale Ebenheits- verkörperungen z.B. Prüfplatten nach DIN 876:1984	bis 30 µm	AA-001 2017-03 bis 10 m Kantenlänge	$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Ebenheitsver- körperung
Geradheitsabweichung ebener Flächen, z.B. 90°- Winkelnormale	bis 30 µm	AA-002 2017-03	$1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = Kantenlänge der Geradheits- verkörperung
Winkelabweichung am 90° - Winkelnormal	bis 30 µm	AA-003 2017-03 bis 500 mm Schenkellänge	1,0 µm	
mit ebenen Flächen		bis 1000 mm Schenkellänge	1,5 µm	

verwendete Abkürzungen:

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
AA	Hausverfahren der Johann Fischer Aschaffenburg Präzisionswerk GmbH & Co. KG

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.